ヘリカル型閉じ込め装置における イオン種の違いが粒子輸送に与える影響 に関する研究

大谷 芳明

本論文は, ヘリカル型閉じ込め装置におけるイオン種の違いが粒子輸送に与える影響 (イ オン種効果) についての研究をまとめたものである. 粒子輸送に対するイオン種効果は ASDEX トカマク及び Compact Helical System (CHS) において調べられ, それぞれ異な る密度依存性が示されているが, 新古典拡散やジャイロボーム拡散では粒子輸送に与える イオン種効果の影響について説明できない. 本論文では, ヘリカル型装置であるヘリオト ロンJ及び LHD において粒子輸送に与えるイオン種効果の影響を評価した. これは, 粒子 輸送に対するイオン種効果の物理機構解明に向けた基礎実験であるだけでなく, 将来のヘ リカル型核融合炉設計において, 軽水素 (H)・重水素 (D) による先行研究結果から重水素-三重水素混合プラズマの閉じ込め性能を外挿する上でも重要な知見となる.

DプラズマとHプラズマの粒子輸送係数を比較するため、ヘリオトロンJにおいて ECH 加熱のD及びHプラズマに対して 50, 100, 125 Hz の変調周波数で密度変調実験を行い、 粒子拡散係数と対流速度を評価した.Dプラズマの粒子拡散係数及び磁気軸中心へ向かう 対流 (内向き対流)速度はHプラズマよりも小さく評価され粒子輸送係数に水素同位体効 果があることが示された.対流速度に対する水素同位体効果はASDEX, CHS と異なる特 徴が見られたが,Hプラズマと比べてDプラズマの粒子拡散係数が小さい特徴は一致した.

HプラズマとHeプラズマの粒子輸送係数を比較するため、LHDにおいてECH加熱のH 及びHeプラズマに対して密度変調実験を行い、粒子拡散係数と対流速度を評価した。He プラズマの粒子拡散係数はHプラズマと比較して、中心領域では小さく、周辺領域では大 きい.また、中心領域の対流速度はHプラズマは外向き、Heプラズマは内向きであり、周 辺領域でのHとHeプラズマの対流速度は同程度であった。ASDEXトカマクと異なり、粒 子拡散係数に対するH-Heイオン種効果が周辺領域と中心領域で異なった。粒子輸送係数 に対するイオン種効果の衝突周波数依存性を評価したところ、周辺の電子内部輸送障壁が 形成されていないL-mode領域において粒子拡散係数に対するイオン種効果には明確な衝 突周波数依存性が見られた。高衝突周波数領域でヘリウムプラズマの粒子拡散係数が軽水 素プラズマよりも大きくなる傾向が示された。一方、対流速度に明確なイオン種効果は現 れなかった。

粒子輸送係数に対するイオン種効果の衝突周波数依存性を議論するために、ヘリオトロンJ,LHD及びCHSの3つの装置で評価した粒子輸送係数の比較を行った.3つの装置の 粒子拡散係数は衝突周波数の減少に伴い粒子拡散係数が増大する傾向が一致した.LHDで は、粒子拡散係数に対するH-Heイオン効果は衝突周波数の減少により減少する.CHSで は、粒子拡散係数に対する水素同位体効果は衝突周波数の減少に伴い増大する.また、ヘリ オトロンJにおいても低衝突周波数領域で水素同位体効果が現れる特徴は一致した.よっ て、LHDの結果とCHSとヘリオトロンJの結果は逆の特徴がある.一方、対流速度に対し ては、LHDではH-Heイオン種効果、CHSでは水素同位体効果が見られなかったが、ヘリ オトロンJではわずかに水素同位体効果が見られ、装置間で違いがあることが分かった.

第1章 序論

核融合を用いた発電は、火力発電と比較して発電時に発生する CO₂ が無い、核分裂による原子力発電と比較して高レベルの放射性廃棄物が核融合反応において生成されず暴走の危険性もない、また、資源に偏在がないという観点から、昨今のエネルギー問題を解決する手段として非常に有力な候補である. 核融合炉の実現のためには、プラズマ化した高温・高密度の燃料イオン (D, T) を長いエネルギー閉じ込め時間で閉じ込める必要がある.

プラズマ粒子を閉じ込める手法の一つである磁場閉じ込め方式による核融合(磁場閉じ 込め核融合)は、荷電粒子がローレンツ力により磁場に巻き付いて運動するという性質を 用いプラズマ粒子を閉じ込める手法である.磁場閉じ込め型装置において、良好な閉じ込 めを実現するためには、粒子の閉じ込めを良くする必要がある.粒子の閉じ込め性能の理 解のためには、粒子輸送特性を解明する必要がある.

イオンの粒子束は次式によって表されるものと考える(粒子束の式).

$$\Gamma_i = -D\nabla n_i + n_i V \tag{1.1}$$

ここで、 Γ_i はイオンの粒子束、 n_i はプラズマ密度、Dは粒子拡散係数、V は対流速度である.対流速度の向きは、磁気軸からプラズマの最外殻へ向かう方向を正と定めている.これを外向き対流、プラズマの最外殻から磁気軸中心へ向かう方向を内向き対流と定義する. プラズマのイオンを直接計測することは困難であるため、一般的に電子密度計測の結果から粒子輸送解析が行う.プラズマの準中性条件からイオン密度 n_i と電子密度 n_e は等しく、イオンの粒子束 Γ_i も電子の粒子束 Γ_e と等しいと考えると、電子の粒子輸送特性を調べることでイオンの粒子輸送特性を評価することができる.粒子輸送解析においては、粒子拡散係数と対流速度という2つのパラメータを評価することが必要である.そのため、密度分布の形状からだけでは評価できず、密度分布の過渡応答を調べる必要がある.粒子拡散係数と対流速度という2つのパラメータを同時に決めるために、ある磁気面における電子の連続の式(粒子バランスの式)を用いる.これは、

$$\frac{\partial n_e}{\partial t} = -\nabla \cdot \Gamma_e + S_e \tag{1.2}$$

と表すことができる. ここで S_e は電子の単位時間, 単位体積当たりの発生量 (粒子ソース) である.

ガスパフを用いた密度変調実験による粒子輸送係数の評価手法は,これまで多くの磁場 閉じ込め装置において行われ,粒子輸送係数の同定に用いられてきた [1][2].

実際の DT 反応による核融合炉の設計段階において, 炉の性能を評価するためには, こ れまでのプラズマ閉じ込め装置の実験から得られた知見から, 粒子, 熱, エネルギーの閉じ 込め性能を予測しなければならない. そのためは, 水素同位体の違いがプラズマの閉じ込 め性能に与える影響 (水素同位体効果) を評価することが重要となる. また, 粒子輸送の物 理機構解明という観点では, 粒子輸送に対してイオンの質量が影響を及ぼすのか或いはイ オンの電荷が影響するのかという問題があり, 軽水素プラズマとヘリウムプラズマの違い が粒子輸送に与える影響 (H-He イオン種効果) を研究することも必要であると考えられる. ASDEX と CHS において粒子輸送に対する水素同位体効果及び H-He イオン種効果 (本論 文では, 総称してイオン種効果と言う) に関する先行研究について述べる. ASDEX では, ガスパフを用いた密度変調実験によって軽水素, 重水素, ヘリウムプラズマの粒子輸送係 数が評価された [3][4].

イオン種の違いによって粒子輸送に与える影響は, ASDEX や CHS で示された重水素プ ラズマと軽水素プラズマに対する実験結果と新古典輸送, ジャイロボーム拡散の理論が予 測するものと異なっており, イオン種の質量が粒子輸送を減少させるという物理機構は未 解明である.また, 重水素プラズマとヘリウムプラズマの粒子輸送が同程度であるという ASDEX の結果は, イオン種の質量によって粒子輸送が変化するだけでなく, イオン種の 電荷によっても粒子輸送が変化すると言うことを示唆している. さらに, この結果は, ジャ イロボーム拡散の予測とは異なっている. 将来のヘリカル型閉じ込め方式による核融合炉 実現のためには,

- ヘリカル型閉じ込め装置による DT 核融合反応を用いた核融合炉を設計するためには、軽水素プラズマや重水素プラズマによる先行研究の結果から DT 混合プラズマの閉じ込め性能を外挿する上で重要な知見である。
- 軽水素プラズマ,重水素プラズマ及びヘリウムプラズマの粒子輸送の比較を行うことにより、プラズマのイオン種の違いが粒子輸送に与える影響の質量依存性、電荷依存性を実験的に調べることで粒子輸送の物理機構解明の一助となる。

という観点から、イオン種の違いが粒子輸送に与える影響を調べることが重要である. 本研究では、ヘリカル型装置の粒子輸送にイオン種の違いが与える影響を調べること を目的としている.具体的には、次に挙げる先行研究における問題点の解決を目的として

いる.

 装置によって軽水素プラズマ,重水素プラズマ及びヘリウムプラズマの粒子輸送係 数の密度依存性が異なっており、イオン種の違いが粒子輸送係数に与える影響には 装置によって異なる可能性がある。 2. 衝突周波数は電子密度に依存性を持つので, イオン種の違いによる粒子輸送係数に 与える影響は衝突周波数依存性がある可能性がある.

この2つの仮説を検証するために,1. に対してはヘリオトロンJ装置[5][6][7][8]において軽 水素プラズマと重水素プラズマの粒子輸送係数の比較及び大型ヘリカル装置(LHD)[9][10][11] において軽水素プラズマとヘリウムプラズマの粒子輸送係数の比較を行った.2. に対し てはLHDにおいて軽水素プラズマとヘリウムプラズマの粒子輸送係数の衝突周波数依存 性を比較することで評価を行った.

本論文は全7章で構成される.

第1章では、これまでの粒子輸送研究、イオン種が粒子輸送に与える影響について調査 された先行研究について述べ、本研究の目的と意義について述べた。第2章では、粒子輸送 係数の評価を行うために開発された遠赤外レーザー干渉計ついて述べる。第3章では、粒 子輸送係数の評価に用いる密度変調法について述べる。まず、電子密度の線積分値に対す る変調周波数成分の径方向分布を評価するために分布再構成手法について述べる。次に、 電子密度の線積分値から変調周波数成分を抽出する手法について述べる。次に、 電子密度の線積分値から変調周波数成分を抽出する手法について述べる。その後、LHD、ヘリ オトロンJにおける具体的な粒子輸送係数評価方法について述べる。第4章では、ヘリオ トロンJにおいて行った重水素プラズマと軽水素プラズマに対する密度変調法による粒子 輸送係数の評価及び比較について述べる。第5章では、LHDにおけて行ったヘリウムプラ ズマと軽水素プラズマに対する密度変調法による粒子輸送係数の評価及び比較について 述べる。また、L-mode 領域における粒子輸送係数の衝突周波数依存性について述べる。第 6章では、ヘリオトロンJ、LHD 及び CHS の結果から、粒子輸送に与えるイオン種効果の 衝突周波数に対する依存性について議論する。最後に、第7章で総括を行う。

第2章 遠赤外レーザー干渉計の開発

密度変調法による粒子輸送係数の評価を行うためには密度変調の伝搬特性の評価及び 高密度プラズマ計測を目的として, 磁気軸を外した位置を視線に持つ FIR レーザー干渉計 の開発を行った.要求仕様である, 計測可能電子密度領域が 1×10^{18} m⁻³ - 1.5×10^{20} m⁻³, 10 μ s 以下の時間分解能, 25 mm 以下の空間分解能を満たすように以下のように設計 を行った.

プラズマの電子密度勾配による屈折の影響は磁気軸を外した視線においては大きいこ とが予測されるため、高密度放電においても、プラズマの屈折効果によるビームの曲がり を低減する必要がある. このため, 光源には波長 337 μm の HCN レーザーを開発した. 干 渉計システムは、ビームの強度変化が計測に影響せず、密度の増減が評価できるヘテロダ イン検波を採用し、低密度のプラズマ計測も可能で機器設置の空間的制約も少ないマイケ ルソン干渉計を構築した. HCN レーザーを使用した場合においても, 高密度放電時には ビームはプラズマの屈折効果によってわずかに曲がってしまう. ビームの屈折による影響 でどの程度の電子密度までを計測可能であるか3次元磁場構造も考慮に入れて評価するた めに、レイトレーシングコード TRAVIS を用いて、高密度放電時のビームの軌跡を評価し た. この結果, ヘリオトロン J で生成された最高密度 1.5 × 10²⁰ m⁻³ のプラズマであって も、検出器前のレンズ内にビーム中心は戻ることが確認された. さらに、近軸近似により ガウシアンビームを模擬し、高密度放電時において検出されるビームのパワーを評価した 結果.1.5×10²⁰ m⁻³ のプラズマに対しても 60 %のパワーがレンズに到達することが確 認された. また, Super Rotating Grating [12] により 1MHz の周波数シフトをかけること により1 MHzのビート信号を得ることができる。このビート信号に対して、解析信号を 用いて位相評価を行い、4 µs の時間分解能で計測することができる. 空間分解能において は集光設計において、プラズマ通過中でのビーム径を 25 mm 以下にすることで実現した.

今までのところ, FIR レーザー干渉計を用いて, 中心電子密度が 1.5×10^{20} m⁻³ 程度の プラズマ計測ができることを実験的には確認できていない. しかしながら, マイクロ波干 渉計で計測できない密度領域である線平均電子密度で 5×10^{19} m⁻³ を超えるプラズマの 計測には成功した. 光線追跡の結果からは 1.5×10^{20} m⁻³ のプラズマに対しても計測が 可能であるので, 今後の高密度プラズマ放電において実験的に 1.5×10^{20} m⁻³ のプラズ マ計測が可能であることを示す必要がある.

第3章 粒子輸送係数評価手法

本研究では、ヘリオトロンJ装置とLHDに対して密度変調実験を行うことにより、粒子 輸送係数の評価を行う.密度変調法は外部からの粒子供給量を正弦波的に増減させること により、周辺領域の電子密度に変調を与え、その空間的な伝搬から、粒子拡散係数と対流速 度を評価する手法である.プラズマの周辺部から粒子供給量を増減させることにより、プ ラズマ周辺に供給される粒子ソースに変調を加えると、プラズマに入射された中性粒子は プラズマ粒子との衝突過程によりイオンと電子に電離する.その結果、プラズマの電子及 びイオン密度が増減し変調されることとなる.粒子供給量を増減させることによって周辺 領域にかけられた密度変調はプラズマの周辺部から磁気軸中心へと伝搬していく.この過 程で密度変調の振幅強度は減衰し、伝搬する密度変調の位相は中心に向かうにつれて遅れ ることになる.この伝搬過程は、プラズマの粒子輸送特性、すなわち粒子拡散係数と対流 速度によって決まる.したがって、密度の変調周波数成分を計測し、その振幅強度比と位 相差を評価することにより、粒子拡散係数と対流速度を評価することができる.

次に,干渉計から求めた密度変調成分の線積分値から,密度変調成分の径方向分布を評価する手法を示した.線積分値から分布へと再構成を行う際には,Tikhonov-Phillips 正則 化法を用い,正則化パラメータは一般交差検証法によって評価した.線積分電子密度から 密度変調成分は,高速フーリエ変換を各視線で得られた線積分電子密度に適用することで 求める.各視線の密度変調成分を基準となる視線の密度変調成分と比較することにより振 幅強度比及び位相差を評価する.

変調実験における粒子拡散係数 D_{mod} , 対流速度 V_{mod} の径方向分布を仮定し, 式 (1.1) と, 式 (1.2) を変調成分に対して適用した

$$\tilde{\Gamma}_e = -D_{mod} \nabla \tilde{n}_e + \tilde{n}_e V_{mod} \tag{3.1}$$

$$\frac{\partial \tilde{n}_e}{\partial t} = -\nabla \cdot \tilde{\Gamma}_e + \tilde{S}_e \tag{3.2}$$

を用いて, 密度変調成分の径方向分布を評価する. ここで, $\tilde{\Gamma}_{e}, \tilde{n}_{e}, \tilde{S}_{e}$ は, それぞれ変調周波 数成分の電子の粒子束, 電子密度分布及び粒子ソース分布である. 式 (3.1), (3.2) を数値的 に解くことにより, \tilde{n}_{e}^{calc} を求める. \tilde{n}_{e}^{calc} は複素数であり, これを用いて干渉計の視線間に おいて計測される振幅強度比と位相差を評価することができる. LHD では干渉計の計測視線が 13ch であるため, 干渉計によって得られる密度変調成分の線積分値から Tikhonov-Phillips 正則化法を用い,密度変調成分の径方向分布を評価することができる. したがって, 粒子輸送係数の評価を行う際にも密度変調成分の径方向分布と一致するような D_{mod} , V_{mod} を探索することができる. 数値計算によって \tilde{n}_e^{calc} を評価するため, D_{mod} と V_{mod} は規格化小半径 ρ の関数として次式のような分布形状を仮定した.

$$D_{mod} = \begin{cases} D_{mod}^{core} & (\rho < 0.425) \\ D_{mod}^{core} + \frac{D_{mod}^{edge} - D_{mod}^{core}}{0.825 - 0.425} (\rho - 0.425) & (0.425 < \rho < 0.825) \\ D_{mod}^{edge} & (0.825 < \rho) \end{cases}$$
(3.3)

$$V_{mod} = \begin{cases} V_{mod}^{core} \frac{\rho}{0.775} & (\rho < 0.775) \\ V_{mod}^{core} + \frac{V_{mod}^{edge} - V_{mod}^{core}}{1.175 - 0.775} (\rho - 0.775) & (0.775 < \rho) \end{cases}$$
(3.4)

ここで、 D_{mod}^{core} は $\rho < 0.425$ における粒子拡散係数、 D_{mod}^{edge} は $\rho > 0.825$ における粒子拡散係数であり、 V_{mod}^{core} は $\rho = 0.775$ における対流速度、 V_{mod}^{edge} は $\rho = 1.175$ における対流速度である. この分布形状は実験結果を参考にして決定した. 粒子ソースはモンテカルロ中性粒子輸送シミュレーションコード EIRENE を用いて計算された結果を用いており、軽水素とヘリウムプラズマとで異なる分布を用いている [13][14]. この粒子拡散係数と対流速度の径方向分布及び粒子ソースを用いて、 \tilde{n}_{e}^{calc} を評価した.

最適な解を評価するために,実験値の密度変調成分の径方向分布と計算値の密度変調成分の径方向分布と計算値の密度変調成分の径方向分布との二乗誤差 χ^2 を定義し,最小化する最適な D_{mod}^{core} , V_{mod}^{edge} , V_{mod}^{edge} を 探索した.

現在, ヘリオトロンJには干渉計が2視線しかないため詳細な密度分布計測ができない. この状況下で粒子輸送係数を評価するために, まず *D_{mod}* 及び *V_{mod}* の分布を

$$D_{mod}(r) = D_{mod0}(const) \tag{3.5}$$

$$V_{mod}(r) = V_{mod0} \frac{r}{a_M} \tag{3.6}$$

と仮定する. ここで, *a_M* = 1.2*a* は最外殻磁気面の半径 *a* を拡張した値である. 粒子ソースの分布はヘリオトロンJにおける先行研究で中性粒子モンテカルロシミュレーションコード DEGAS を用いて計算された結果を参考に

$$\left|\tilde{S}_{e}(\rho)\right| = S_{e0} \exp\left[-\left(\frac{\rho - 1.08}{0.35}\right)^{2}\right]$$
(3.7)

としている [15][16][17]. 本解析においては, 重水素プラズマと軽水素プラズマに対する粒 子ソース分布を同じ分布とした.

次に、マイクロ波干渉計とFIR レーザー干渉計の視線間で評価される振幅比 R_a^{exp} と位相差 ϕ^{exp} を評価する.

$$R_a^{exp} = \frac{\|\tilde{\tilde{n}}^{FIR_{exp}}\|}{\|\tilde{\tilde{n}}^{MICRO_{exp}}\|}$$
(3.8)

$$\phi^{exp} = \arctan\left[\frac{\operatorname{Im}\left(\tilde{\tilde{n}}^{FIR_{exp}} \cdot \tilde{\tilde{n}}^{MICRO_{exp}*}\right)}{\operatorname{Re}\left(\tilde{\tilde{n}}^{FIR_{exp}} \cdot \tilde{\tilde{n}}^{MICRO_{exp}*}\right)}\right]$$
(3.9)

ここで, $\tilde{n}^{FIR_{exp}}$, $\tilde{n}^{MICRO_{exp}}$ は FIR レーザー干渉計及びマイクロ波干渉計で計測した線平 均電子密度の変調周波数成分である.

変調周波数成分に対するフーリエ成分の実部と虚部の径方向分布 \tilde{n}_{e}^{calc} を評価する.このとき,プラズマの小半径は0.18 m であると仮定し, $\rho = 0.01 - 1.2$ まで0.01 刻みで解析を行った.得られた変調周波数成分の径方向分布を干渉計の視線に対して視線積分を行った.実座標と規格化小半径の関係を用いて, \tilde{n}_{e}^{calc} の FIR レーザー干渉計による視線平均及びマイクロ波干渉計による視線平均 $\tilde{n}^{FIR_{calc}}$, $\tilde{n}^{MICRO_{calc}}$ をそれぞれ求める.これらを用いて2つの干渉計間の振幅比と位相差は,

$$R_a^{calc} == \frac{\|\tilde{\tilde{n}}^{FIR_{calc}}\|}{\|\tilde{\tilde{n}}^{MICRO_{calc}}\|}$$
(3.10)

$$\phi^{calc} = \arctan\left[\frac{\operatorname{Im}\left(\tilde{\tilde{n}}^{FIR_{calc}} \cdot \tilde{\tilde{n}}^{MICRO_{calc}*}\right)}{\operatorname{Re}\left(\tilde{\tilde{n}}^{FIR_{calc}} \cdot \tilde{\tilde{n}}^{MICRO_{calc}*}\right)}\right]$$
(3.11)

と求めることができる.

計算結果と実験結果が一致する最適な解を評価するために, 二乗誤差 χ^2 を定義し, 最小 化するような D_{mod} , V_{mod} を探索した.

第4章 ヘリオトロンJにおける重水素プ ラズマと軽水素プラズマに対する 粒子輸送の比較

ヘリオトロンJにおいて, 重水素プラズマと軽水素プラズマに対して密度の減衰時間の 評価及び密度変調実験を行うことにより, 粒子輸送に対する水素同位体効果が与える影響 を評価した.これは, 現在のヘリオトロンJ装置と同じ磁場配位を持つ核融合炉を設計す るために重要な知見となるのみならず, 粒子輸送に与える水素同位体効果の物理機構解明 への一助となりうる重要な研究である.

まず, 実効的な粒子閉じ込め時間の違いを, ガスパフからの粒子供給を切り, 密度の減 衰時間を評価することにより比較した. その結果, 重水素プラズマの密度の減衰時間は 11 ms, 軽水素プラズマの密度の減衰時間は 8 ms と重水素プラズマの方が実効的な粒子の閉 じ込め時間が長いという結論を得た. しかしながら, ガスパフはオフにしたものの, 密度 の減衰時間には放電管壁からのリサイクリングによる粒子供給は含まれているため, 単純 にこの結果からだけでは, 重水素プラズマの粒子閉じ込めが良いという判断はできない.

そこで, 放電管壁からのリサイクリングによる粒子供給を考慮に入れずに, 定量的に粒子の閉じ込めを評価するため, 密度変調法を用いて粒子拡散係数と対流速度を個別に評価した.その結果を用いて, 重水素プラズマと軽水素プラズマの粒子輸送特性の違い調べた. 放電条件は, 線平均電子密度 0.6 × 10¹⁹ m⁻³, 中心電子温度 1 - 1.3 keV のプラズマに対して評価を行った. 変調周波数は 50, 100, 125 Hz を選択した.

実験によって2つの干渉計で計測した線平均電子密度に対してFFT をかけ得られるスペクトルの変調周波数成分に対して相関解析を行うことにより,2視線間の変調振幅比と 位相差を評価した.その結果,軽水素プラズマと重水素プラズマの変調振幅比には有意な 差が見られた.この結果に対して粒子輸送係数の評価を試みた.粒子輸送係数及び粒子 ソースの径方向分布形状のモデルを仮定して,変調振幅及び位相遅れの径方向分布を評価 した.この変調振幅及び位相遅れの径方向分布から2つの干渉計によって計測されうる振 幅強度比と位相差を計算し,実験結果と比較することにより粒子輸送係数を評価した.そ の結果,重水素プラズマに対しては50 Hz,100 Hz,125 Hz の変調周波数から得られた粒 子拡散係数は,軽水素プラズマで得られた粒子拡散係数と比較して小さく評価された.と りわけ, 50 Hz の変調周波数の場合, 重水素プラズマの粒子拡散係数は, 40 % 程度小さく 見積もられた.

実効的閉じ込め時間と粒子拡散係数から求めた閉じ込め時間を比較したところ,重水素 プラズマと軽水素プラズマの粒子拡散係数から求めた閉じ込め時間の差は,実効的閉じ込 め時間の差よりも小さかった.重水素プラズマの方が閉じ込め時間が長いという特徴は一 致しているが,実効的な閉じ込め時間で見られた重水素プラズマと軽水素プラズマの差に は,粒子輸送の違いとリサイクリングの違いが両方含まれていることが分かった.

ASDEX, CHS と粒子拡散係数に現れる水素同位体効果の比較を行うと, ヘリオトロン Jの場合においても重水素プラズマの粒子拡散係数が軽水素プラズマと比較して小さいと いう特徴は一致した.しかしながら,対流速度に現れる水素同位体効果に対しては装置間 で差異が見られた.この原因として,磁場配位の違いや加熱手法の違いがあげられる.こ の切り分けには, ヘリオトロンJにおいて ECH プラズマに対して磁場配位依存性を評価 する必要があると考えられる.また,対流速度は,温度勾配に起因する非対角項等の量をま とめたものである.したがって, ASDEX, CHS, ヘリオトロンJの密度変調実験において 加熱手法が異なっているため,温度勾配分布の違いが生じ対流速度に現れる水素同位体効 果に差異が現れた可能性もある.この検証のためには, NBI 加熱プラズマに対する粒子輸 送係数の評価及び温度勾配も考慮に入れた粒子輸送解析を行う必要があると考えられる.

評価された粒子輸送係数を用いて電子密度分布を評価するとNd:YAGトムソン散乱計 測で評価した電子密度分布と比較してピークした分布となった.この原因は,粒子輸送係 数の径方向分布モデルが実際のプラズマの粒子輸送係数の径方向分布と異なっていること が影響している可能性が考えられる.現状2視線の干渉計しかないため,フィッティング パラメータが2つしか決めることができない.フィッティングパラメータを増やして解析 を行うためには,多チャンネル化を進め電子密度の径方向分布を評価する必要がある.先 行研究では,干渉計測によって電子密度を評価するためには5 ch あれば可能であることが 示されている [18].これにより,粒子輸送係数のモデルが実際の粒子輸送係数の径方向分 布と違うことによって内向き対流が増大したのかどうかを切り分けることが可能である. また,密度勾配と粒子束の間に強い非線形性がある場合,密度変調法によって求めた粒子 拡散係数と対流速度は定常状態の粒子拡散係数及び対流速度と一致しないという指摘も ある [19].多チャンネル化によって粒子輸送係数の径方向分布モデルに起因するものなの か,密度変調法によって求めた粒子輸送係数と定常状態の粒子輸送係数に違いがあるのか を切り分けることが可能になると考えられる.

第5章 LHDにおける軽水素プラズマと ヘリウムプラズマに対する粒子輸 送の比較

ヘリカル型装置において, 軽水素とヘリウムプラズマの粒子輸送に違いがあるかどうか は明らかではなく, この違いを定量的に評価することは重要である. ヘリウムプラズマの 粒子輸送係数の評価は重水素プラズマの粒子輸送係数と併せることにより, 粒子輸送係数 に対するイオン種の質量及び電荷が与える影響に関する物理機構解明への一助となると 考えられる.本章では, 第3章において示した手法をLHDで生成された ECH 加熱プラズ マの密度変調実験へ適用し, その結果を用いて, 軽水素プラズマ及びヘリウムプラズマの 粒子輸送係数を評価及びその差異を比較した.

まず,同じ放電条件の軽水素プラズマとヘリウムプラズマに対して密度変調法によって 粒子輸送係数の評価を行った. ECH加熱の中心電子密度2×10¹⁹ m⁻³,中心電子温度は2.5 - 3.0 keV 程度のプラズマパラメータをもつ軽水素プラズマとヘリウムプラズマに対して 1.25 Hz で密度変調をかけ,密度変調成分の振幅強度と位相遅れを評価した.周辺領域で は軽水素プラズマの方がヘリウムプラズマより変調振幅が大きく,評価された位相遅れは 同程度であった.中心領域では軽水素プラズマとヘリウムプラズマで位相分布に構造的な 違いが見られた.この変調成分に対して粒子拡散係数と対流速度を評価すると,軽水素プ ラズマはヘリウムプラズマと比較して,中心領域の粒子拡散係数が大きく,周辺領域の粒 子拡散係数が小さいことが示された.また,対流速度に関しては,軽水素プラズマにおいて は中心では外向きの対流が強い傾向にあり,周辺部では同程度の内向き対流速度であった.

さらに, 粒子拡散係数と対流速度の衝突周波数依存性を評価することを試みた. そのた め, 広い衝突周波数領域で粒子拡散係数と対流速度を評価するために, 中心電子温度の高 い時間領域及び 2.5 Hz の変調周波数のものも解析に含めた. 中心領域においては, 粒子輸 送係数に顕著な衝突周波数依存性はなかった. 本実験条件のヘリウムプラズマは揺動の安 定・不安定の境界上にあるため, わずかなパラメータの違いで揺動強度が変化する可能性 がある. そのため, 粒子拡散係数にばらつきが生じたのではないかと予測される. 一方, 周 辺部の粒子拡散係数と対流速度の衝突周波数依存性を評価したところ, 軽水素プラズマと ヘリウムプラズマの粒子拡散係数は, 1/ν 領域では差がないが, プラトー領域においては ヘリウムプラズマの粒子拡散係数が大きくなる傾向が示された.一方,対流速度に関して は,衝突周波数によらずイオン種効果は見られなかった.中心電子温度の高い時間領域で は中心領域では, e-ITB が発生していると考えられるが,周辺領域では温度勾配も小さく L-mode 領域であると考えられる.よって,ECH 加熱の L-mode 領域における軽水素プラ ズマとヘリウムプラズマの粒子拡散係数に対するイオン種効果には衝突周波数依存性があ り,プラトー領域でヘリウムプラズマの粒子輸送が大きくなる傾向が示されたといえる.

以上のことから, 粒子輸送係数に対する H-He イオン種効果があることは確認された. 軽 水素プラズマとヘリウムプラズマは質量のみならず電荷も異なっている. そのため, 本実 験からでは粒子輸送係数に質量依存性があるのか, 電荷依存性があるのかを評価すること ができない. この問題は, 軽水素イオンと同じ電荷で異なる質量を持つ重水素イオンに対 して密度変調法を用いて粒子輸送係数を評価することで明らかにできると考えられる. ま た, 粒子輸送係数に対する H-He イオン種効果は ASDEX の結果と異なり, 中心領域と周 辺領域で異なることが分かった. さらに, L-mode 領域では粒子輸送係数に対する H-He イ オン種効果は衝突周波数に対して依存性を持つこともわかった.

第6章 ヘリオトロンJ, LHD 及びCHS における粒子輸送係数の比較

本章では、LHD、CHS 及びヘリオトロンJの粒子輸送係数の規格化衝突周波数依存性に ついて評価を行った.本章で扱ったデータは、LHD 及びヘリオトロンJでは ECH プラズ マに対する粒子輸送係数、CHS では NBI プラズマに対する粒子輸送係数である [2].また、 LHD では軽水素プラズマとヘリウムプラズマの比較、ヘリオトロンJ及び CHS では軽水 素プラズマと重水素プラズマの比較を行ったデータである.

粒子拡散係数はいずれの装置,加熱手法,イオン種によらず規格化衝突周波数の減少に 伴って粒子拡散係数が増大するという傾向が一致し,粒子拡散係数は装置によらず規格化 衝突周波数で整理できる可能性を示した.一方,対流速度に対しては,ヘリオトロンJの 対流速度が他装置と比較して非常に大きな内向き対流となり,とりわけ,高い変調周波数 においてこの傾向は顕著であった.この点に関しては,フィッティングパラメータが不足 しているのか実際にこのような大きな内向き対流を持つのかの切り分けができていない ため,議論は困難である.

次に、LHDとCHSにおいて粒子拡散係数に対するイオン種効果の比較を行った.LHD の軽水素プラズマとヘリウムプラズマを比較すると、衝突周波数の増大とともに軽水素プ ラズマに対するヘリウムプラズマの粒子拡散係数が大きくなり、H-Heイオン種効果が明 確になってくる.一方、CHSの軽水素プラズマに対する重水素プラズマの粒子拡散係数を 比較すると衝突周波数の減少とともに重水素プラズマに対する軽水素プラズマの粒子拡散 係数が大きくなり、水素同位体効果が明確になってくる.以上の結果から、装置の違い、加 熱手法の違いがイオン種効果の大小関係に影響を与えないと仮定すれば、H-Heイオン種 効果と水素同位体効果の衝突周波数依存性が異なることが示唆される.重水素イオンとへ リウムイオンは質量及び電荷がともに異なっている.CHSでは質量の増加とともに粒子 拡散係数が小さくなる傾向が現れたことから、LHDにおいてヘリウムイオンの粒子拡散 係数が軽水素プラズマよりも大きくなった原因は電荷によるものである可能性が考えられ る.しかしながら、LHDとCHSの間では、装置サイズ、磁場配位、加熱方法が異なってお り、単一装置で軽水素、重水素、ヘリウムプラズマの粒子拡散係数を比較して、この傾向が 現れることを検証する必要がある.一方で、ヘリオトロンJプラズマの衝突周波数領域は、 CHSで生成されたプラズマの衝突周波数領域とくらべて小さい.このような低い衝突周 波数領域においても重水素プラズマの方が粒子拡散係数が小さいという傾向は一致した. したがって、CHS とヘリオトロンJの実験では装置の違い、加熱方法の違いはあるものの、 低衝突周波数領域で質量の大きい水素同位体の粒子拡散係数が小さくなる可能性が示唆 された.また、ヘリオトロンJプラズマの対流速度の絶対値の比較に関する議論は困難で あるのに対して、LHD、CHS ではイオン種の違いにより対流速度に大きな違いは無かった が、ヘリオトロンJではわずかに重水素プラズマの方が内向き対流が小さい傾向にあった.

第7章 総括

本論文では、粒子輸送に対するイオン種の違いが与える効果を評価することを目的とした.そのために、ヘリオトロンJプラズマの粒子輸送係数を密度変調法により評価するために FIR レーザー干渉計を開発した.開発した FIR レーザー干渉計と既存のマイクロ波 干渉計から得られる線平均電子密度を基に、軽水素プラズマと重水素プラズマの粒子拡散 係数及び対流速度を評価し、水素同位体効果が粒子輸送に与える影響を評価した.ヘリオ トロンJにおける標準磁場配位のプラズマを対象として、粒子輸送に対する水素同位体効 果を評価した.

また, LHD における軽水素プラズマとヘリウムプラズマの粒子拡散係数及び対流速度 を評価し、イオン種が粒子輸送に与える影響を評価した.磁気軸 *R* = 3.6 m のプラズマ粒 子輸送に対する軽水素、ヘリウム間のイオン種の効果を評価した.

これは, 粒子輸送に対するイオン種の違いが与える効果を解明するのみならず, 将来の ヘリカル型 DT 核融合による核融合炉における閉じ込め性能を評価する上で重要な意味合 いを持つだけでなく, トーラスプラズマの粒子輸送に対する水素同位体効果に関する物理 機構の解明にも寄与することができる重要な研究テーマであり, 本論文はその基礎研究と して意義がある.

各章の要旨を以下に述べる.

第1章では、エネルギー問題について述べ、核融合研究の重要性について概説した.また、これまでの粒子輸送研究について示し、ASDEXトカマク及び CHS において行われたイオン種の違いによる粒子輸送係数の依存性を調べた先行研究について述べた.さらに、新古典輸送及び異常輸送について概説し、これらの表式からでは ASDEX や CHS の結果を説明することができないということについて述べた.

第2章では, 粒子輸送係数評価のため開発した遠赤外レーザー干渉計について述べた. 本 FIR レーザー干渉計は磁気軸を外した位置に視線が設計されており, 密度変調法により 変調された密度の伝搬特性を評価することができる.また, 粒子輸送研究においては, 幅 広い密度領域における粒子輸送係数の評価が必要であるため, 電子密度が 1.5×10^{20} m⁻³ のプラズマ計測が可能であるように設計している.また, 計測例として電子密度がおよそ 5×10^{19} m⁻³ のプラズマの計測結果を示した. 第3章では、本研究において用いた密度変調法について述べた. 粒子輸送を評価するた めにはプラズマの密度勾配によって生じる粒子束である拡散項と密度勾配がない状態にお いても生じる粒子束である対流項を個別に求める必要がある. そのためには、密度変調の 伝搬特性を求める必要がある. 密度変調の伝搬特性である変調振幅分布と位相分布を, 干 渉計測によって得られた線積分電子密度から評価するため, Tikhonov-Phillips 法及び一般 交差検証による正則化パラメータの探索手法を用いた分布再構成手法を示した.

密度変調実験によって得られる線積分電子密度から粒子輸送係数を評価する手法を示した.干渉計測によって得られる線積分電子密度から,密度変調成分の線積分値を評価する 手法を示した.この実験結果に対して Fitting 法により粒子拡散係数と対流速度の最適値 を探索する手法を示した.最後に,この手法をヘリオトロンJ及び LHD に適用する方法を それぞれ示した.

第4章では、粒子輸送係数に与える水素同位体効果の影響を評価するために、 ヘリオト ロンJにおいて重水素プラズマと軽水素プラズマの粒子輸送の比較を行った.まず,重水 素プラズマと軽水素プラズマの実効的粒子閉じ込め時間の評価を行った.加熱条件はECH で、線平均電子密度 0.7×10¹⁹ m⁻³ のプラズマに対して粒子供給を止めた後の減衰時間を 比較することで評価を行った. その結果、重水素プラズマ及び軽水素プラズマの実効的粒 子閉じ込め時間はそれぞれ 11 ms, 8 ms であり, 重水素プラズマの閉じ込めが良い可能性 が示唆されたが、リサイクリングによる粒子ソースによって差が生じた可能性もある. リ サイクリングによる粒子ソースの影響を除くために,密度変調実験を行い,粒子拡散係数 と対流速度の評価を行った.プラズマは ECH によって加熱し,線平均電子密度 0.6×10¹⁹ m⁻³とした. 変調周波数には, 50 Hz, 100 Hz, 125 Hz を用いた. 計測には 2 つの干渉計を 用い, 主として 0.05 < ρ < 0.35 の領域に生じる変調振幅強度と位相差を評価した. 粒子 ソースは重水素と軽水素と同じ分布を利用した. 粒子輸送係数の評価を行った結果, 50 Hz の密度変調実験において、重水素プラズマの粒子拡散係数は軽水素プラズマより40%ほ ど小さいことがわかった.また、対流速度は50 Hz の密度変調実験において、重水素プラ ズマの方が軽水素プラズマより内向きの対流が15 m/s 大きかった. 100, 125 Hz でも同 様の傾向が見られたが、その差はわずかであった. これは、粒子輸送係数の径方向分布の 仮定によって生じた可能性と、実際に粒子輸送係数に変調周波数依存性がある可能性が考 えられ、今後明らかにしていく必要がある.

ヘリオトロンJにおける粒子拡散係数の解析結果は、ASDEXトカマクや低密度領域に おける CHS の結果と同じく、重水素プラズマの方が軽水素プラズマより小さかった. ヘリ オトロンJの対流速度は、ASDEXトカマクと異なり、周辺部では重水素プラズマの方が 軽水素プラズマよりも内向き対流が小さかった. CHS では、重水素プラズマの方が軽水素 プラズマよりも内向き対流が大きく、ヘリオトロンJと逆の特徴が示された. よって、ヘ リオトロン J における対流速度への水素同位体効果は, ASDEX トカマク, CHS の結果と 異なる特徴があることが示された.

第5章では、イオン種の違いが粒子輸送係数に与える影響を評価するために、LHDにおいて軽水素プラズマとヘリウムプラズマに対する密度変調実験を行った. ガスパフによって1.25 Hz で密度変調がかけられた ECH 加熱の軽水素プラズマとヘリウムプラズマに対して粒子輸送係数の評価を行った. 軽水素プラズマとヘリウムプラズマのプラズマパラメータをそろえるために、線積分電子密度3×10¹⁹ m⁻²、中心電子温度2.5 – 3.0 keV のプラズマに対して、粒子輸送係数を評価した. その結果、軽水素プラズマの中心領域の粒子拡散係数はヘリウムプラズマと比べて大きく、軽水素プラズマの周辺領域の粒子拡散係数はヘリウムプラズマと比べて大きく、軽水素プラズマの周辺領域の粒子拡散係数はヘリウムプラズマと比べして外向きの対流が強い傾向にあり、 $\rho = 1.175$ では軽水素プラズマの対流速度はヘリウムプラズマと同程度の対流速度であることが示された.

ASDEX トカマクにおいてはプラズマ全域でヘリウムプラズマの粒子拡散係数が軽水素 プラズマより小さく評価されおり,本研究の結果と比較すると異なる.よって,軽水素プ ラズマとヘリウムプラズマの粒子輸送においても装置間で異なることが示された.

粒子輸送に対するイオン種効果の衝突周波数依存性を評価した.中心領域 ($\rho = 0.3$) で は, 粒子拡散係数,対流速度に衝突周波数依存性は見られなかったが周辺領域 ($\rho = 0.9$: L-mode 領域)の粒子輸送係数には明確な衝突周波数依存性が見られた.粒子拡散係数に 対して $1/\nu$ 領域ではイオン種による影響がないが,プラトー領域においては 1.5 - 2 倍程 度へリウムプラズマの方が大きく,粒子拡散係数に対する H-He イオン種効果に衝突周波 数依存性があることが示された.また,対流速度に対しては,粒子拡散係数と比較して両 者に顕著な差がないことが示された.よって,LHD の ECH 加熱プラズマにおいては,粒 子拡散係数に衝突周波数依存性がありプラトー領域で明確なイオン種による差が現れる ことがわかった.

第6章では、粒子輸送係数の規格化衝突周波数依存性を調べるために、LHD、CHS 及び ヘリオトロンJの実験結果の比較を行った.L-mode領域の比較を行うため、LHD に対し ては $\rho = 0.9$ 、CHS に対しては $\rho = 0.7$ 、ヘリオトロンJに対しては $\rho = 0.7$ の位置を解析対 象とした.いずれの装置においても、粒子拡散係数は規格化衝突周波数の減少に伴い増大 する傾向が見られた.一方対流速度については、顕著な衝突周波数依存性は見られなかっ た.次に、CHS 及び LHD に対して粒子拡散係数に表れるイオン種効果の衝突周波数依存 性を比較した.CHS の水素同位体効果では、衝突周波数の減少に伴い重水素プラズマの方 が軽水素プラズマよりも粒子拡散係数が小さくなる傾向がある.一方、LHD のイオン種効 果では、衝突周波数の増大に伴いヘリウムプラズマの方が軽水素プラズマよりも粒子拡散 係数が大きくなる傾向があり, CHS に現れた水素同位体効果の衝突周波数依存性と逆の傾向を示した.これは,装置,加熱手法により各イオン種の粒子拡散係数の大小関係が変わらないならば,粒子拡散係数に対する水素同位体効果とH-He イオン種効果とは逆の衝突周波数依存性を持つ可能性が示された. ヘリオトロンJにおける衝突周波数領域は, 1/ν領域であり,粒子拡散係数は重水素プラズマの方が軽水素プラズマよりも小さかった. CHS の結果とあわせると,低衝突周波数領域で粒子拡散係数に水素同位体効果が現れると予測される.しかしながら,装置・加熱手法が異なるプラズマの比較であり実験結果も1点しかないため, ヘリオトロンJにおいても条件をそろえ衝突周波数スキャンを行う必要がある.

一方,対流速度については,LHDやCHSではイオン種効果,水素同位体効果が見られな かった.また,ヘリオトロンJの対流速度はLHD,CHSと比較して非常に大きな内向き対 流となった.この原因として粒子輸送係数の径方向分布形状の仮定による影響があると考 えられるため絶対値の比較は困難であるが,他装置と比較してわずかに水素同位体効果が 見られた.今後,多チャンネル化を行い対流速度の径方向分布を考慮に入れた上で対流速 度の絶対値の比較を行う必要がある.

本論文で得られた粒子輸送に対するイオン種の効果をより明確にするためには,評価す る衝突周波数領域を広げる必要がある.また,装置間比較の観点からは個々の装置で軽水 素,重水素,へリウムプラズマの粒子輸送を比較する必要がある.さらに,乱流の成長率と 粒子輸送の関連も調べられるべきと考えられる.そのために,ヘリオトロンJにおいては,

- 電子密度の径方向分布をより詳細に評価し、粒子輸送係数の径方向分布を評価。
- 磁場配位・加熱手法と水素同位体効果の関係の評価.

といったことを調べられることが期待される. さらに, 様々な磁場配位へ拡張することに より, ヘリカル軸ヘリオトロン磁場配位における水素同位体効果に関する知見が得られる と考えられる.

一方, LHD においては, 重水素プラズマの粒子輸送を評価することにより, 粒子輸送に 対するイオン種の質量依存性, 電荷依存性が明確になる. そのため,

- 軽水素と重水素の比較を行い、ヘリオトロンJでの結果と比較する.
- 軽水素と重水素の比較を行い、今回評価した軽水素とヘリウムに対する実験結果と 比較する。
- イオン温度計測を行い新古典輸送を数値計算で評価し、実験結果と差をとることで 異常輸送を評価する.
- 衝突周波数と揺動強度の依存性を実験的に評価する.

といったことを調べられる必要がある.また,磁場配位によってイオン種が粒子輸送に与 える影響が変わるか否かの議論や,装置間比較に関する研究も進むと考えられる.

参考文献

- [1] K. W. Gentle et al., Plasma Phys. Control. Fusion Vol.26, No.12 (1984)
- [2] K. Tanaka et al., Plasma Phys. Controlled Fusion 58 055011(2016)
- [3] K. W. Gentle et al., Nucl. Fusion, Vol. 32. No. 2 (1992)
- [4] M. Bessenrodt-Weberpals et al., J. Nucl. Mater. 196-198, 943-947 (1992)
- [5] T. Obiki et al., in Plasma Physics and Controlled Nuclear Fusion Research 1992 (Proc. 14th Int. Conf, Wurzburg, 1992) Vol.2, IAEA, Vienna 403.(1993)
- [6] F. Sano et al., J. Plasma Fusion Res. SERIES 3 26 (2000)
- [7] T. Obiki et al., Nucl. Fusion 41 833 (2001)
- [8] M. Wakatani, Stellarator and Heliotron Devices (Oxford, New York, 1998).
- [9] O. Motojima, et al., Nucl. Fusion 40, 599 (2000).
- [10] 竹入康彦, 核融合科学技術委員会, 原型炉開発総合戦略タスクフォース 12 月 24 日 (2015)
- [11] 核融合科学研究所ホームページ"http://www.nifs.ac.jp/"
- [12] T.Maekawa et al., Rev. Sci. Instrum., Vol. 62, p. 304 (1991)
- [13] D. Reiter, P. Gogen, U. Samm, J. Nucl. Mater. 196198, 1059 (1992)
- [14] Shoji et al., J. Nucl. Mater. 363365, 827832 (2007)
- [15] S. Kobayashi et al., Proceedings of the 31th EPS Conference on Plasma Physics, London, P5-097 (2004)
- [16] D.B. Heifetz et al., J. Comp. Phys. 46, 309 (1982)

- [17] D.B. Heifetz, Physics of Plasma-Wall Interactions in Controlled Fusion, Eds. D.E. Post and R. Behrisch (Plenum Press, New York 1986) p.695.
- [18] N. Shi et al., Rev. Sci. Instrum. 85 053506 (2014)
- [19] N. J. Lopes Cardozo, Plasma Phys. Control. Fusion 37 799 (1995)